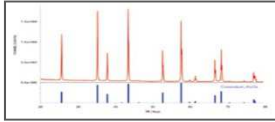
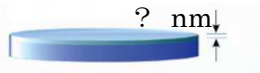


材料評価用 X 線回折装置 Smart Lab のアプリケーション

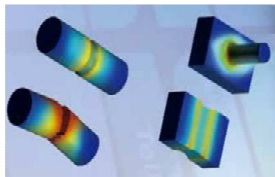
結晶相同定、
定量分析



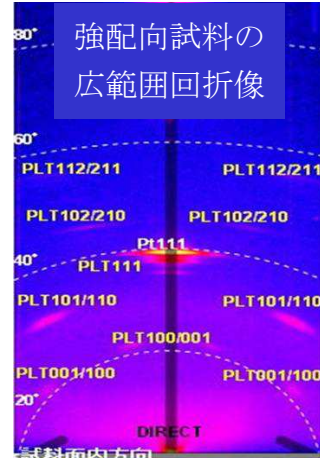
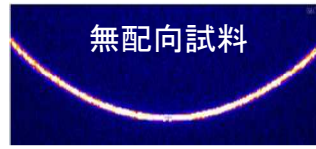
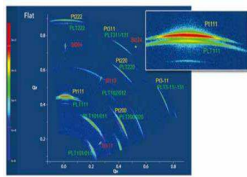
薄膜の膜厚、
ラフネス評価



高速残留応力測定



逆格子マップ測定



X 線回折測定
の
さまざまな測定事例

高速 2 次元半導体検出器を
利用したアプリケーション